

# DIN EN 15079:2015-07 (D)

## Kupfer und Kupferlegierungen - Analyse durch optische Emissionsspektrometrie mit Funkenanregung (F-OES); Deutsche Fassung EN 15079:2015

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Gerät</b> .....	<b>5</b>
<b>5.1 Optisches Emissionsspektrometer</b> .....	<b>5</b>
<b>5.2 Gerät zur Präparation der Probenoberfläche</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Probenahme</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Vorgehensweise</b> .....	<b>6</b>
<b>7.1 Oberflächenvorbereitung</b> .....	<b>6</b>
<b>7.2 Kalibrierverfahren</b> .....	<b>6</b>
<b>7.3 Analyse</b> .....	<b>8</b>
<b>8 Angabe der Ergebnisse</b> .....	<b>9</b>
<b>9 Präzision</b> .....	<b>9</b>
<b>10 Prüfbericht</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang A (informativ) Wellenlängen für spektrometrische Messungen und typische Kalibrierbereiche für Kupfer und Kupferlegierungen</b> .....	<b>10</b>
<b>Anhang B (informativ) Wellenlängen, Untergrundäquivalentkonzentrationen (BEC) und Nachweisgrenzen (DL) für Reinkupfer</b> .....	<b>15</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>17</b>